

可见与红外光轴平行度检测仪

Visible and Infrared Light Axis Parallelism Detector



主要技术与性能指标

- 系统测量精度：3"
- 系统口径：Φ180 mm
- 红外光波波长范围：8—14 μm
- 可见光波波长范围：0.45—0.78 μm

主要应用

应用于可见与红外复合光轴平行度检测

代表性应用成果

解决了高精度捕获跟瞄设备中的红外光光轴与可见光光轴平行度检测问题

主要用户单位	中国科学院光电技术研究所		
研制单位	中国科学院光电技术研究所		
联系方式	杨文志	028-85101315, 18081117949	ywz@ioe.ac.cn